

2LB: 第54回日本生物物理学会年会 FEIランチョンセミナー

The Revolution of Cryo-TEM

- 日時: 2016年11月26日(土) 11:45 - 12:35
- 会場: B会場(中会議室202)
- 講演者: 重松 秀樹 先生
(理化学研究所ライフサイエンス技術基盤センター)
- 演題: クライオ電子顕微鏡法における革新と我々の取り組み
- 要旨:

クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)という単語がトップジャーナルを賑わすようになってそろそろ3年がすぎようとしている。構造データベースへの登録数はうなぎ登りという表現がピッタリの上昇曲線を描いており、今後も分野としての成長が期待される。クライオ電子顕微鏡研究者により、モデリングが可能な分解能の構造が発表される状況が続き、現在ではX線結晶構造解析で著名な研究者がクライオ電子顕微鏡を導入し、結晶化が困難な試料や分解能の伸びなかった試料の構造を発表する状況がはじまってきている。

本講演では、結晶化を必要とせず、必要量も比較的少量ですむクライオ電子顕微鏡単粒子解析での高分解能構造取得へ向けた我々の試みを紹介する。2014年に理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター横浜キャンパスに導入されたFEI Tecnai ArcticaとFalcon2の組み合わせにより長時間かつ高画質の画像取得の自動化が可能となり、巨大分子複合体の高分解能構造を取得することに成功している。



日本エフイー・アイ株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-13-34 NSSIIビル4F
TEL: 03-3740-0970(代)
FAX: 03-3740-0975

Learn more at FEI.com

